

РЫНОК	
TEXAS INSTRUMENTS. РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ <i>Лебедев И.</i>	6-8
КОМПОНЕНТЫ	
ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПАНИИ VISHAY ДЛЯ ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ <i>Верхулевский К.</i>	10-16
СЕМЕЙСТВО XGS КМОП-ДАТЧИКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ ON SEMICONDUCTOR <i>Самарин А., Болихов О.</i>	18-24
CITY TECHNOLOGY - НОВЫЙ ИГРОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ <i>Рентюк В.</i>	26-31
СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D СО СВЕРХМАЛЫМИ УРОВНЯМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ <i>Макаренко В.</i>	32-37
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ НА FPGA. ЧАСТЬ 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ <i>Соловьев В.</i>	38-48
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ	
ИМС КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА «ВП» БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ИНТЕРФЕЙСА RS-485/422 5559IN85T	49
КОМПОНЕНТЫ	
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ НА БАЗЕ ПЛИС И ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ ФИРМЫ XILINX В САПР СЕРИИ VIVADO HLX DESIGN SUITE. ЧАСТЬ 2 <i>Зотов В.</i>	50-57
STM32H7: ПЕРВЫЙ STM32, СОВМЕСТИМЫЙ С SECURE MODULE INSTALL <i>Морозов А.</i>	58-59
ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА ESP-EYE НА БАЗЕ ESP32 <i>Доброхотов Д.</i>	60-61
РАДИАЦИОННО СТОЙКИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ БИКМОП-СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ 1395 <i>Баранов Д., Минина Н., Ястребов П.</i>	62-64
RFID	
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ RFID ФИРМЫ ELATEC	66-67
ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
КОМПОЗИТНЫЕ УСИЛИТЕЛИ: СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ <i>Локинарио Д.</i>	68-73
КАК ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРАЙВЕРА СИГМА-ДЕЛЬТА-АЦП <i>Сервис С., Мерино М.У.</i>	74-80
АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В КОРПУСЕ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА. ЧАСТЬ 3 <i>Колесникова Т.</i>	81-93
ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ГЛУБИНЫ ОТ КОМПАНИИ ANALOG DEVICES ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ <i>Рентюк В.</i>	94-99

**КАК ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ
СОВМЕСТИМОСТЬ IOT-УСТРОЙСТВ** 100-105
Максвелл М.

**ЭКРАНЫ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ: ПОНИМАНИЕ
ОСНОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ TDK** 106-114
Рентюк В.

ТЕХНОЛОГИИ

**КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРОВ
СИГНАЛОВ** 116-125
Рентюк В.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГРАНИЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ БЛОКОВ СБИС** 126-128
Пилипенко А.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ «ТРЕТИЙ ПИН» 130-135
Ларионов И.